



УТВЕРЖДАЮ
Г.А. Пискунов, директор ЦКП,
Зам. директора ИМХ РАН

А.В. Пискунов

«02» сентября 2024 г.

**Прейскурант типовых услуг ЦКП «Аналитический центр ИМХ РАН»
часть I (термохимические методы, методы ЯМР и ЭПР, методы рентгеновской дифракции,
молекулярная спектроскопия, хроматографические методы, элементный анализ)**

№ п/п	Услуга (работа)	Стоимость с НДС
1.	Исследование образца методом дифференциальной сканирующей калориметрии	10 440,00
2.	Исследование термодеструкции образца методом синхронного термического анализа 30 - 900°C без идентификации продуктов разложения	6 180,00
3.	Регистрация ¹ H ЯМР-спектра (дейтерированный растворитель Заказчика)	720,00
4.	Регистрация ¹ H ЯМР-спектра образца (дейтерированный растворитель Исполнителя)	1 440,00
5.	Получение ¹³ C ЯМР-спектра хорошо растворимого в дейтерированных растворителях образца (1 час работы прибора)	3 600,00
	Каждый последующий час работы прибора	2 400,00
6.	Получение ЯМР спектров на ядрах ¹⁹ F	4 200,00
7.	Получение ЯМР спектров на ядрах ¹¹ B, ¹⁵ N, ³¹ P, ²⁹ Si (1 час работы прибора)	4 200,00
8.	Двумерная методика ЯМР 1H, 1H – COSY (час работы прибора)	4 800,00
9.	Регистрация изотропного спектра ЭПР при комнатной температуре	1 800,00
10.	Регистрация анизотропного спектра ЭПР при температуре 77 К	2 400,00
11.	Регистрация температурной зависимости спектра ЭПР в интервале температур 130 - 400 К	6 000,00
12.	Разработка методики исследования парамагнитного образца методом спектроскопии ЭПР	42 000,00
13.	Рентгеноструктурный анализ монокристаллов	12 000,00
14.	Разработка методики дифрактометрического определения образца неизвестной структуры	42 000,00
15.	Качественный рентгенофазовый анализ смесей соединений (получение порошковых рентгенограмм, определение фазового состава функциональных материалов (до пяти фаз))	12 000,00
16.	Количественный рентгенофазовый анализ смесей соединений (получение порошковых рентгенограмм, проведение качественного и количественного фазового анализа смеси соединений методом рентгеновской дифракции при наличии информации об их кристаллических структурах (до трех фаз) с проведением моделирование методом полнопрофильного анализа)	24 000,00
17.	Исследование растворенного образца методом спектрофлуориметрии	1 200,00
18.	Исследование твердого образца методом спектрофлуориметрии	1 200,00
19.	Регистрация ИК-спектра твердого образца в вазелиновом масле(в таблетке KBr) в диапазоне 400 – 4000 см ⁻¹ .	1 200,00
20.	Регистрация ИК-спектра жидкого образца в диапазоне 400 – 4000 см ⁻¹ .	1 200,00
21.	Регистрация спектра комбинационного рассеяния твердого образца.	1 200,00

№ п/п	Услуга (работа)	Стоимость с НДС
22.	Исследование образца методом спектрофотометрии в УФ- и видимой области спектра	1 200,00
23.	Качественный анализ образца методом газовой хромато-масс-спектрометрии	5 400,00
24.	Количественный анализ образца методом газовой хромато-масс-спектрометрии	6 000,00
25.	Количественный анализ органических соединений методом газовой хроматографии	4 800,00
26.	Количественный анализ органического соединения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием	5 400,00
27.	Измерение удельной поверхности материалов методом низкотемпературной адсорбции аргона (расчет по методу БЭТ)	6 000,00
28.	Определение молекулярно-массового распределения полимеров методом эксклюзионной хроматографии	6 000,00
29.	Количественный элементный анализ твердых образцов (CHNS)	3 600,00

**Прейскурант типовых услуг ЦКП «Аналитический центр ИМХ РАН»
часть II (механический анализ, порометрия, методы электронной микроскопии)**

№ п/п	Услуга (работа)	Краткое описание услуги (работы)	Единица измерения	Стоимость с НДС
30.	Исследование серии образцов на растяжение или сжатие методом динамометрии	Построение кривых зависимости напряжения от деформации образца и определение предельного напряжения при разрушении и модуля упругости	Серия из семи образцов одного состава	7 200,00
31.	Измерение пикнометрической плотности функциональных материалов по He, N ₂	Определение пикнометрической плотности методом вытеснения газа при комнатной температуре и атмосферном давлении.	образец	5 100,00
32.	Пробоподготовка для исследования морфологии поверхности непроводящих материалов методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)	Нанесение проводящего покрытия на объект перед СЭМ исследованием	- ((-	1 100,00
33.	Исследование морфологии поверхности проводящих материалов методом СЭМ с использованием одного детектора (вторичных или обратно отраженных электронов)	Регистрация СЭМ изображений для проводящих объектов или для непроводящих объектов с металлическим/углеродным напылением с использованием одного детектора в интервале увеличений от ×35 до ×1 000 000 крат	- ((-	8 000,00
34.	Надбавка за исследование морфологии поверхности непроводящих материалов методом СЭМ с использованием	Регистрация СЭМ изображений для непроводящих объектов с использованием одного детектора в интервале увеличений от ×35 до	- ((-	6 000,00

№ п/п	Услуга (работа)	Краткое описание услуги (работы)	Единица измерения	Стоимость с НДС
	одного детектора (вторичных или обратно отраженных электронов)	×1 000 000 крат		
35.	Надбавка за использование одного дополнительного детектора СЭМ	Регистрация СЭМ изображений с использованием одного дополнительного детектора в интервале увеличений от ×35 до ×1 000 000 крат	- ((-	8 000,00
36.	Анализ химического состава (элементный анализ) образца с использованием энергодисперсионного рентгеновского спектрометра (ЭДС) СЭМ	Регистрация СЭМ-изображений и спектров ЭДС в трех различных характерных точках поверхности образца.	- ((-	4 100,00
37.	Анализ распределения химических элементов по поверхности образца с использованием ЭДС СЭМ	Регистрация СЭМ-изображений и карт распределения элементов на поверхности образца в трех различных характерных точках.	- ((-	8 000,00
38.	Экспертный анализ СЭМ изображений	Описание морфологии объекта, определение размеров структур.	- ((-	8 000,00
39.	Статистическая обработка СЭМ изображений	Построение гистограмм распределений частиц по размерам с применением специализированного ПО.	- ((-	12 000,00
40.	Графическая обработка СЭМ изображений	Оптимизация СЭМ изображений, подготовка СЭМ изображений для публикации.	- ((-	16 200,00
41.	Исследование образцов методом ртутной порометрии	Определение удельной поверхности, кажущейся плотности, объема пор и распределения их по размерам в диапазоне от 3.6 нм до 110 мкм для образцов не образующих амальгаму.	- ((-	20 100,00
42.	Исследование образцов методом ртутной порометрии в расширенном диапазоне размеров определяемых пор	Определение удельной поверхности, кажущейся плотности, объема пор и распределения их по размерам в диапазоне от 3.6 нм до 1000 мкм для образцов не образующих амальгаму.	- ((-	30 000,00
43.	Исследование методом ртутной порометрии образцов образующих амальгаму	Определение удельной поверхности, кажущейся плотности, объема пор и распределения их по размерам в диапазоне от 3.6 нм до 110 мкм для образцов образующих амальгаму.	- ((-	40 200,00
44.	Исследование методом ртутной порометрии образцов образующих амальгаму, в расширенном диапазоне размеров определяемых пор	Определение удельной поверхности, кажущейся плотности, объема пор и распределения их по размерам в диапазоне от 3.6 нм до 1000 мкм для образцов образующих амальгаму.	- ((-	60 000,00
45.	Измерение пикнометрической плотности образцов по He, N ₂	Определение пикнометрической плотности методом вытеснения газа	- ((-	5 100,00

№ п/п	Услуга (работа)	Краткое описание услуги (работы)	Единица измерения	Стоимость с НДС
		при комнатной температуре и атмосферном давлении.		
46.	Стоимость труда сотрудников	Сбор информации, экспертиза литературных данных и результатов экспериментов, выполнение экспериментальных работ без использования сложного и дорогостоящего оборудования, подготовка отчетных документов	час	5 000,00